

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60749-4

Première édition
First edition
2002-04

**Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –**

**Partie 4:
Essai continu fortement accéléré
de contrainte de chaleur humide (HAST)**

**Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –**

**Part 4:
Damp heat, steady state,
highly accelerated stress test (HAST)**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60749-4:2002